

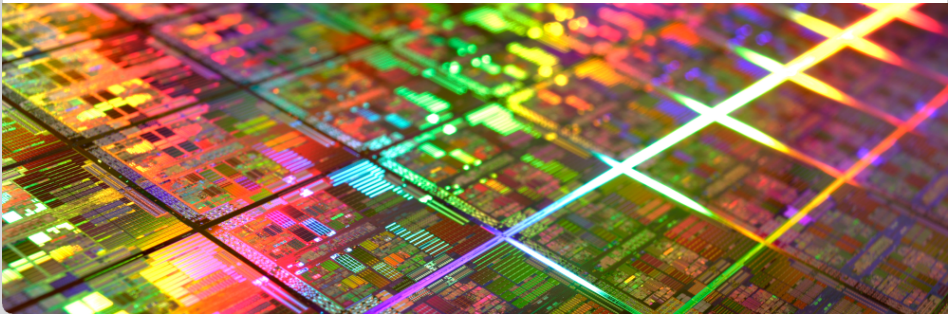
Zentralübung Rechnerstrukturen im SS 2014

Fragen des Rechnerentwurfs: Fertigung und Hardwareentwurf

Oliver Mattes, Prof. Dr. Wolfgang Karl

Lehrstuhl für Rechnerarchitektur und Parallelverarbeitung

24. April 2014



Chip-Fertigung:

- Definitionen
- Aufgabe 1: Fertigungskosten

Schaltungsentwurf mit VHDL:

- Einführung in VHDL
- Aufgabe 2: Signale und boolsche Funktionen
- Aufgabe 3: Verhaltensbeschreibung
- Aufgabe 4: VHDL-Entwurfsprozess – Zähler
- Aufgabe 5: VHDL-Entwurfsprozess – DFT

- Fertigung auf Wafern
 - Größe/Durchmesser des Wafers $\Rightarrow$ Grundfläche
- Aufteilen in einzelne Chip-Plättchen (**Die**)
 - Fläche/Form des Dies $\Rightarrow$ Dies per Wafer
- Endkunde erhält:
 - **Die** für sog. *bond-out*
 - Die wird vom Kunden in Schaltung/Platine direkt integriert
 - Kein Packaging
 - End-Prüfung im Rahmen des Gerätetests
 - **Chip im Gehäuse**
 - Test des Dies
 - Packaging: Einsetzen des Dies in Gehäuse (Bonding)
 - Finaler Test

Kenngrößen des Wafers

- $cost_{wafer}$: Fertigungskosten des rohen Wafers (Siliziumscheibe)
- d_{wafer} : Größe/Durchmesser, liefert Fläche $A_{wafer} = \pi(d_{wafer}/2)^2$
- Y_{wafer} : Yield/Ausbeute („gute“ Wafer)

Kenngrößen des Dies

- **Dies per Wafer** (DPW):

Die-Fläche A_{die} und Wafer-Fläche A_{wafer} korreliert

$$DPW = A - B = \frac{A_{wafer}}{A_{die}} - B = \frac{\pi * (d_{wafer}/2)^2}{A_{die}} - \frac{\pi * d_{wafer}}{\sqrt{2 * A_{die}}}$$

A: theoretisches Maximum

B: Verschnitt

Kenngrößen des Dies

- $DPUA$: Fehlerquote (defects per unit area)
- α : Technologiekonstante (Maß für Komplexität bzw. Fertigungstechnologie)
- Y_{die} : Yield/Ausbeute, funktionsfähige Dies

$$Y_{die} = Y_{wafer} * \left(1 + \frac{DPUA * A_{die}}{\alpha} \right)^{-\alpha}$$

- Fertigungskosten pro Die

$$cost_{die} = \frac{cost_{wafer}}{DPW * Y_{die}}$$

Test und Assemblierung

- Kosten
 - Die-Test: $cost_{die-test}$
 - Packaging: $cost_{packaging}$
- Packaging-Kosten beinhalten zusätzliche Test-Kosten (IC-Test, Endkontrolle)
- Endausbeute/Yield: Y_{final}

Gesamtkosten

- Pro integriertem Schaltkreis (IC):

$$cost_{IC} = \frac{cost_{die} + cost_{die-test} + cost_{packaging}}{Y_{final}}$$

Aufgabe 1

Eine Wafer-Fertigungsanlage soll von 200 mm- auf 300 mm- Wafer umgestellt werden. Der Fertigungsprozess wird hierbei nicht verändert, der zugehörige Technologiefaktor α sei 2, die Fehlerquote (*defects per unit area*) betrage $DPUA = 0,2/cm^2$ und die Wafer-Ausbeute (*Yield*) betrage $Y_{wafer} = 80\%$. Der zu fertigende Die habe eine Fläche von $A_{die} = 4,5 cm^2$.

- a) Berechnen Sie für beide Wafergrößen die erzielbare Anzahl von Dies pro Wafer.

$$DPW = \frac{\pi * \left(\frac{1}{2} * d_{wafer}\right)^2}{A_{die}} - \frac{\pi * d_{wafer}}{\sqrt{2 * A_{die}}}$$

$$\begin{aligned} DPW_{200} &= \frac{\pi * \left(\frac{1}{2} * 20cm\right)^2}{4,5cm^2} - \frac{\pi * 20cm}{\sqrt{2 * 4,5cm^2}} \\ &= \pi * \left(\frac{100}{4,5} - \frac{20}{3}\right) = \pi * \frac{200-60}{9} = \frac{140}{9} \pi \approx 48 \text{ Dies} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} DPW_{300} &= \frac{\pi * \left(\frac{1}{2} * 30cm\right)^2}{4,5cm^2} - \frac{\pi * 30cm}{\sqrt{2 * 4,5cm^2}} \\ &= \pi * \left(\frac{225}{3} - \frac{30}{3}\right) = \pi * (50 - 10) = 40\pi \approx 125 \text{ Dies} \end{aligned}$$

Aufgabe 1

Eine Wafer-Fertigungsanlage soll von 200 mm- auf 300 mm- Wafer umgestellt werden. Der Fertigungsprozess wird hierbei nicht verändert, der zugehörige Technologiefaktor α sei 2, die Fehlerquote (*defects per unit area*) betrage $DPUA = 0,2/cm^2$ und die Wafer-Ausbeute (*Yield*) betrage $Y_{wafer} = 80\%$. Der zu fertigende Die habe eine Fläche von $A_{die} = 4,5 cm^2$.

b) Errechnen Sie den Die-Yield für die gegebenen Parameter.

$$Y_{die} = Y_{wafer} * \left(1 + \frac{DPUA * A_{die}}{\alpha} \right)^{-\alpha}$$

$$Y_{die} = 0,8 * \left(1 + \frac{0,2 * 4,5}{2} \right)^{-2} \approx 0,8 * 0,476 = 0,38$$

Aufgabe 1

- c) Errechnen Sie die Kosten pro Die für 200 mm und 300 mm-Technologie unter der Annahme, dass ein 200 mm-Wafer 150 Euro kostet und ein 300 mm-Wafer 300 Euro.

$$cost_{die} = \frac{cost_{wafer}}{DPW * Y_{die}}$$

Berechnet: $DPW_{200} = 48$, $DPW_{300} = 125$, $Y_{die} = 0,38$

$$cost_{200} = \frac{150 \text{ €}}{48 * 0,38} = 8,22 \text{ €}$$

$$cost_{300} = \frac{300 \text{ €}}{125 * 0,38} = 6,32 \text{ €}$$

Aufgabe 1

- d) Berechnen Sie basierend auf den errechneten Werten der vorherigen Aufgabenteile die durch die Umstellung auf 300 mm-Wafer erzielte Kostenreduzierung pro IC. Die Kosten für das Packaging pro IC betragen 75 cent, der Kostenanteil für Testen des einzelnen Dies sei 1 Euro und die Gesamtausbeute sei 75 %.

$$cost_{ic} = \frac{cost_{die} + cost_{test} + cost_{pkg}}{Y_{final}}$$

$$cost_{ic200} = \frac{8,22\text{€} + 1\text{€} + 0,75\text{€}}{0,75} = \frac{9,97\text{€}}{0,75} = 13,29\text{€}$$

$$cost_{ic300} = \frac{6,32\text{€} + 1\text{€} + 0,75\text{€}}{0,75} = \frac{8,07\text{€}}{0,75} = 10,76\text{€}$$

$$\text{Einsparung: } 13,29\text{€} - 10,76\text{€} = 2,53\text{€}$$

$$\text{Kostensenkung um: } 1 - \frac{10,76\text{€}}{13,29\text{€}} = 1 - 0,81 = 0,19 = 19\%$$

- e) In Zukunft war geplant von 300 mm- auf 450 mm-Wafer umzustellen, doch eine Einführung wird vorerst aufgeschoben. Was könnten bei der Einführung noch größerer Wafer Probleme bereiten?

Mögliche Probleme (Liste nicht vollständig):

- Längere Abkühlungszeit pro Verarbeitungsschritt
- längere gesamte Fertigungsdauer
- Höheres Gewicht des Silizium-Kristalls
- ...

Chip-Fertigung:

- Definitionen
- Aufgabe 1: Fertigungskosten

Schaltungsentwurf mit VHDL:

- Einführung in VHDL
- Aufgabe 2: Signale und boolsche Funktionen
- Aufgabe 3: Verhaltensbeschreibung
- Aufgabe 4: VHDL-Entwurfsprozess – Zähler
- Aufgabe 5: VHDL-Entwurfsprozess – DFT

VHDL

- **VHDL** – **V**HSIC **HDL** – Very-High-Speed Integrated Circuits Hardware Description Language
- Beschreibungssprache, keine Programmiersprache
- Vom US-Verteidigungsministerium zur Dokumentation und Simulation von Schaltungen / ASICs ins Leben gerufen
- (HW-)Synthese erst später
- Syntax ähnlich der Programmiersprache Ada
- **Simulations- und Syntheseprogramme unterstützen nicht unbedingt den kompletten Sprachumfang**

Entity

- Definition der Schnittstelle eines Hardwaremoduls

Architecture

- **Funktionale Verhaltensbeschreibung**
- **Strukturelle Beschreibung** eines Moduls
- Mischung beider Beschreibungsarten

Configuration

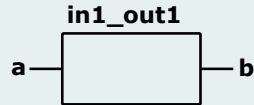
Zuweisung einer Architecture zur verwendeten Entity

Entity

- **Definition der Schnittstelle** („Leere Hülle“)
- ⇒ Ein- und Ausgänge (Ports) eines Hardwaremoduls
- Festlegung der Datentypen der Ein- und Ausgänge

Entity

```
-- Ich bin ein Kommentar
entity in1_out1 is
  port (
    a : in bit;
    b : out bit
  );
end in1_out1;
```



Signale

- Verbindung zwischen verschiedenen Komponenten
- Signale speichern (puffern) auch Werte
- Signale haben einen Datentyp
- Deklaration:

```
signal a, b, out : bit;
```
- Wertzuweisung durch `<=`

```
out <= '1';
```
- **Achtung: Keine mehrfachen Zuweisungen!**
- Wertzuweisung erst gültig nach der Abarbeitung aller Operationen des umfassenden Blocks!

Variablen

- Werte innerhalb eines Prozesses
- Variablen haben einen Datentyp
- Deklaration:

```
variable state : bit;
```

- Wertzuweisung durch :=

```
state := not state;
```

- Wertzuweisung erfolgt sofort
- Deklaration mit Standardwert:

```
variable state : bit := '1';
```

Prozess

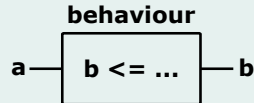
- Haupteinheit einer Verhaltensbeschreibung in VHDL
- **Sensitivity List**: Signale, bei deren Änderung der Prozess ausgeführt wird
- **Mehrere Prozesse werden gleichzeitig abgearbeitet**
- Rückhalten der Zuweisungen bis Blockende

Beispiel

```
invertieren : process (invert)
  variable state : bit := '1';
begin
  if invert'event then
    state := not state;
  end if;
  out <= state;
end process invertieren;
```

Architecture

- „Füllung“ einer Entity mit Inhalt
 - Inhalt, d.h. Logik bzw. Aufbau der Schaltung
 - Mehrere Architekturen können für eine Entity definiert werden
- ⇒ Auswahl mit Hilfe einer Configuration



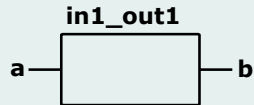
- Verschiedene Möglichkeiten:
 - **Funktionale Verhaltensbeschreibung**
 - **Strukturelle Beschreibung** eines Moduls
 - Mischung beider Beschreibungsarten

Funktionale Verhaltensbeschreibung

- Beschreibung der Funktionalität einer Schaltung
- Die interne Struktur wird abstrahiert
- Verhaltensbeschreibung vergleichbar mit einem Programm
- In einfachen Fällen durch eine direkte Funktion
- Wird oft „Behaviour“ genannt.
- Hauptbestandteil einer Verhaltensbeschreibung ist der Prozess
- Funktionales Verhalten durch **nebenläufige Anweisungen**

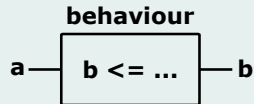
Entity

```
entity in1_out1 is
  port (
    a : in bit;
    b : out bit
  );
end in1_out1;
```



Architecture – Verhaltensbeschreibung

```
architecture behaviour of in1_out1 is
begin
  invertieren : process(a)
  begin
    if a = '1' then
      b <= '0';
    else
      b <= '1';
    end if;
  end process invertieren;
end behaviour;
```



Strukturelle Beschreibung

- Zusammensetzen verschiedener Untermodule zu einer Schaltung
- Beschreibung einer Schaltung durch Aufteilung in verschiedene Untermodule
- Wird oft „Structure“ genannt.

Strukturelle Beschreibung

Verwendung:

① Komponentendeklaration

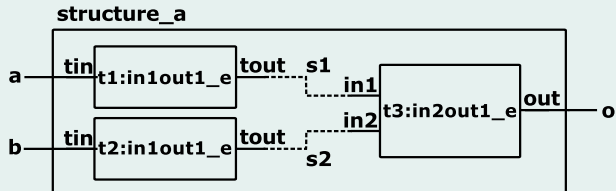
- Deklaration der Schnittstelle der Untermodule
- ⇒ Wiederholung der Entity des Untermoduls
- Durch die Deklaration wird kein Untermodul erzeugt!

② Instanziierung der Untermodule

- Erzeugung eines oder mehrerer Untermoduls des angegebenen Typs
- Mehrere Instanzen, d.h. mehrere Untermoduls vom selben Typ möglich
- Verbindung der Untermodule durch Signale
 - Angabe der Verbindungen mit Hilfe der „port map“

Architecture – Strukturelle Beschreibung

```
architecture structure_a of entity_name is
  component in1out1_e
    port (tin : in bit; tout : out bit);
  end component;
  component in2out1_e
    port (in1 : in bit; in2 : in bit; out : out bit);
  end component;
  signal s1, s2 : bit;
begin
  t1 : in1out1_e port map (a, s1);
  t2 : in1out1_e port map (b, s2);
  t3 : in2out1_e port map (out => o, in1 => s1, in2 => s2);
end structure_a;
```



Configuration

- Auswahl der gewünschten Architekturbeschreibung für eine Entity (d.h. Auswahl des internen Aufbaus)
- Auswahl der zu verwendenden Beschreibungen für einzelne Instanzen in strukturellen Beschreibungen
- Auswahl der gewünschten Architekturbeschreibung für einzelne/alle Instanzen einer Entity
- Festlegung des internen Aufbaus bei mehreren Möglichkeiten
- Verbindung von Signalen und Ports, . . .

Möglichkeiten zur Konfiguration

- Zusätzliche Schaltungseinheit „configuration“
- Komponentenkonfiguration in der Architekturbeschreibung

Signale und boolesche Funktionen

Erstellen Sie je eine VHDL-Beschreibung der XOR-Funktion mittels

- a) Bibliotheksaufruf
- b) Boolescher Beschreibung
- c) Wertetabelle
- d) Beschreibung der Funktion

a) Bibliotheksaufruf

Einladen benötigter Bibliotheken:

```
library IEEE;  
use IEEE.std_logic_1164.all;
```

```
c <= a XOR b;
```

b) Boolesche Beschreibung

XOR : $(A \wedge \neg B) \vee (\neg A \wedge B)$

```
c <= (a and not(b)) or (not(a) and b);
```

Aufgabe 2

c) Wertetabelle

a	b	c
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

`c <='0' when a='0' and b='0' else
 '1' when a='0' and b='1' else
 '1' when a='1' and b='0' else
 '0' when a='1' and b='1';`

d) Beschreibung der Funktion

```
c <= '0' when a=b else '1';
```

bzw.

```
if ((a='1' and b='1') or (a='0' and b='0')) then  
    c <= '0';  
else  
    c <= '1';  
end if;
```

Aufgabe 3 – Verhaltensbeschreibung

Eine zu entwickelnde Zählerschaltung soll folgendes Verhalten aufweisen:

- Ein low-aktives Rücksetzsignal löscht den Zähler.
- Über ein Richtungssignal wird bestimmt, ob der Zähler mit der steigenden Flanke eines Taktsignals aufwärts (=0) oder abwärts (=1) zählt.
- Es wird nur gezählt, wenn der Zähler mit einem high-aktiven Aktivierungssignal freigeschaltet ist.
- Der Zähler soll 64 Zählschritte ausführen können.
- Ein low-aktives Freigabesignal entscheidet, ob der Zählerausgang auf einen gemeinsamen Bus gelegt werden soll; bei nicht erfolgter Freigabe werden die Ausgabeleitungen in den Tristate-Zustand geschaltet.

Aufgabe 3 – Verhaltensbeschreibung

- a) Erstellen Sie die zugehörige **Schnittstellenbeschreibung** und formulieren Sie die entsprechende Verhaltensbeschreibung in VHDL.

Schnittstellenbeschreibung

- **Entity** beschreibt Ein-/Ausgabeschnittstelle
- Angabe der Schnittstellen über `port`
- Richtung und Typ der Ports
- Pro Modul nur eine Entity

Lösung: Schnittstellenbeschreibung

```
entity counter is
  port (
    clk, rst_n : in  std_logic;
    direction   : in  std_logic;
    enable      : in  std_logic; --enable circuit
    select_n    : in  std_logic; --read counter value
    value       : out std_logic_vector(5 downto 0)
  );
end entity;
```

Aufgabe 3 – Verhaltensbeschreibung

- a) Erstellen Sie die zugehörige Schnittstellenbeschreibung und formulieren Sie die entsprechende **Verhaltensbeschreibung** in VHDL.

Verhaltensbeschreibung

- Implementierung der Funktionalität eines (Teil-)Moduls in einer **Architecture**
- „Berechnung“ der Ausgangssignalwerte anhand der Eingangssignale und des bisherigen Zustands
- Prozesse zur Bündelung
 - Alle Prozesse laufen prinzipiell parallel
- Nebenläufige / asynchrone Zuweisungen

Lösung: Verhaltensbeschreibung

- Problemfall: `value` ist als reines Ausgabesignal deklariert, kann nicht gelesen und als Zähler verwendet werden
- ⇒ Deklaration eines Signal als eigentlicher Zähler
- Ausgabe des Zählers erfolgt außerhalb des Prozesses mit low-aktivem Freigabesignal

```
architecture arch_counter of counter is
    signal count : unsigned(5 downto 0) := "000000"; -- 2^6=64 Zustände
begin

    -- Ausgabe
    value <= std_logic_vector(count) when select_n='0'
        else (others=>'Z');

end arch_counter;
```

Aufgabe 3 – Verhaltensbeschreibung

- a) Erstellen Sie die zugehörige Schnittstellenbeschreibung und formulieren Sie die entsprechende **Verhaltensbeschreibung** in VHDL.

VHDL-Prozesse

- Implementierung einer/der (Teil-)Funktionalität
- Reagieren auf Ereignisse in Sensibilitätsliste:
`process (clk, rst_n)`
- Zustand häufig über Zustandsautomaten gehandhabt
- Verwendung logischer und arithmetischer Operatoren
- if/case/when zur Kontroll- und Datenflusssteuerung

Lösung: Verhaltensbeschreibung

Prozess zerfällt in asynchrones Rücksetzen und eigentlichen Zählvorgang

```
p_counter: process (rst_n, clk),
begin
    -- asynchronous reset
    if rst_n='0' then
        count <= "000000";

    -- counting function, triggered by clock
    elsif clk'event and clk='1' then

        -- counter enabled?
        if enable = '1' then
            -- counting direction
            if direction='0' then
                count <= count+1;
            else
                count <= count-1;
            end if;
        end if;

    end if;
end process;
```

Aufgabe 3 – Verhaltensbeschreibung

- b) Erweitern Sie die Verhaltensbeschreibung um eine Lösung, bei der ein Überlaufsignal außerhalb des Prozesses erzeugt wird.

Über-/Unterlaufsfunktion

Der Zähler soll um eine Über-/Unterlaufsfunktion ergänzt werden, d.h. beim Wechsel von 63 zu 0 (*Aufwärtszählen*) bzw. 0 zu 63 (*Abwärtszählen*) wird für die Dauer eines Taktes ein Anzeigesignal ausgegeben. Hierbei soll das Rücksetzsignal nicht fälschlicherweise das Überlaufssignal auslösen.

In der Entity sei hierzu das zusätzliche Signal `ov1` vom Typ `std_logic` mit Modus `out` deklariert.

Über-/Unterlaufsfunktion

Da eine Abfrage auf Zählerstand 0 auch im Reset-Fall auslösen würde, ist hier eine Lösung zu finden, um festzustellen, ob tatsächlich ein Über-/Unterlauf stattfand. Hierzu wird das höchstwertige Bit des Zählers gespeichert und in den Test auf Zählerstand 0 miteinbezogen. Im Unterschied zum nachfolgenden Aufgabenteil kann hier direkt auf den entsprechenden Zählerstand verglichen werden. Bezüglich der Komplexität der Abfrage ändert sich nichts.

```
architecture arch_counter_ovl2 of counter is
    signal count : unsigned(5 downto 0) := "000000";
    signal store : std_logic; -- Zustandsspeicher
begin
```

Aufgabe 3 – Verhaltensbeschreibung

```
p_counter: process(rst_n, clk)
begin
    -- asynchrones Rücksetzen
    if rst_n='0' then
        count <= "000000";
        store <= '0';

    -- Zählfunktion
    elsif clk'event and clk='1' then

        -- Bit 5 des Zählers merken
        store <= count(5);

        -- Zähler selektiert?
        if enable='1' then
            if direction='0' then
                count <= count+1;
            else
                count <= count-1;
            end if;

        end if;

    end if;

end if;
end process;
```

Aufgabe 3 – Verhaltensbeschreibung

```
-- Über/Unterlauf?
ovl<='1' when count="000000" and store='1' and direction='0'
      else '1' when count="111111" and direction='1'
      else '0';

-- Ausgabe
value <= std_logic_vector(count) when select_n='0'
      else (others=>'Z');

end arch_counter_ovl2;
```

Aufgabe 4 - VHDL-Entwurfsprozess I

In einer VHDL-Beschreibung sei ein Prozess wie folgt beschrieben.

```
architecture behaviour of counter is
    signal count : unsigned(7 downto 0);
begin

    process(clk)
    begin
        if clk'event and clk='1' then
            count <= count+1;
            if count=X"ff" then
                flag <= '1';
            else
                flag <= '0';
            end if;
        end if;
    end process;
end behaviour;
```

Aufgabe 4 - VHDL-Entwurfsprozess I

- a) Bei der Simulation dieses Prozesses erhalten Sie immer den Wert "UUUUUUUU" für das Signal `count`. Synthetisiert in Hardware beobachten Sie jedoch wie erwartet eine Aufwärtszählfunktion.
- Nennen Sie die Ursache für das in der Simulation beobachtete Verhalten und erklären Sie, weswegen die Zählfunktion hier nicht sichtbar wird.

⇒ `count` ist undefiniert, der Wert `count+1` („undefiniert+1“) ist daher ebenfalls undefiniert.

⇒ Initialisierung mit Standardwert:

```
architecture behaviour of counter is
    signal count : unsigned(7 downto 0) := "00000000";
begin
    ...
end;
```

Aufgabe 4 - VHDL-Entwurfsprozess I

- a) Bei der Simulation dieses Prozesses erhalten Sie immer den Wert "UUUUUUUU" für das Signal `count`. Synthetisiert in Hardware beobachten Sie jedoch wie erwartet eine Aufwärtszählfunktion.
- Nennen Sie die Ursache für das in der Simulation beobachtete Verhalten und erklären Sie, weswegen die Zählfunktion hier nicht sichtbar wird.
- ⇒ `count` ist undefiniert, der Wert `count+1` („undefiniert+1“) ist daher ebenfalls undefiniert.

⇒ Initialisierung mit Standardwert:

```
architecture behaviour of counter is
    signal count : unsigned(7 downto 0) := "00000000";
begin
    ...
```

- a) Bei der Simulation dieses Prozesses erhalten Sie immer den Wert "UUUUUUUU" für das Signal `count`. Synthetisiert in Hardware beobachten Sie jedoch wie erwartet eine Aufwärtszählfunktion.
- Nennen Sie die Ursache für das in der Simulation beobachtete Verhalten und erklären Sie, weswegen die Zählfunktion hier nicht sichtbar wird.
- ⇒ `count` ist undefiniert, der Wert `count+1` („undefiniert+1“) ist daher ebenfalls undefiniert.
- ⇒ Initialisierung mit Standardwert:
- ```
architecture behaviour of counter is
 signal count : unsigned(7 downto 0) := "00000000";
begin
 ...
```

# Aufgabe 4 - VHDL-Entwurfsprozess I

- a) Bei der Simulation dieses Prozesses erhalten Sie immer den Wert "UUUUUUUU" für das Signal `count`. Synthetisiert in Hardware beobachten Sie jedoch wie erwartet eine Aufwärtzzählfunktion.
- Ändern Sie die Prozessbeschreibung so ab, dass der Wert des Zählers zurückgesetzt werden kann.

⇒ Zurücksetzen des Zählers mittels Reset:

```
process(rst, clk)
begin
 if rst='1'
 then count<="00000000";
 elseif clk'event and clk='1' then
 count <= count+1;
 ...
 end if;
end process;
```

- a) Bei der Simulation dieses Prozesses erhalten Sie immer den Wert "UUUUUUUU" für das Signal `count`. Synthetisiert in Hardware beobachten Sie jedoch wie erwartet eine Aufwärtzählfunktion.
- Ändern Sie die Prozessbeschreibung so ab, dass der Wert des Zählers zurückgesetzt werden kann.

⇒ Zurücksetzen des Zählers mittels Reset:

```
process(rst, clk)
begin
 if rst='1'
 then count<="00000000";
 elseif clk'event and clk='1' then
 count <= count+1;
 ...
 end if;
end process;
```

# Aufgabe 4 - VHDL-Entwurfsprozess I

- b) Das `flag`-Signal (vom Typ `bit`) soll den Zählerstand `0xff` anzeigen, d.h. zum Zeitpunkt `count=X'ff` für eine Taktperiode den Wert 1 annehmen, sonst 0.
- Bei welchen tatsächlichen Zählerstand beobachten Sie beim gegebenen Codefragment in Simulation und Synthese den Zustand `flag='1'`? Warum ist dies so?
- ⇒ Die Zählerinkrementierung wird erst mit einer Verzögerung von einem Taktzyklus sichtbar, darum wird das Signal `flag` tatsächlich den Zählerstand `0x00` signalisieren.

- b) Das `flag`-Signal (vom Typ `bit`) soll den Zählerstand `0xff` anzeigen, d.h. zum Zeitpunkt `count=X'ff` für eine Taktperiode den Wert 1 annehmen, sonst 0.
- Bei welchen tatsächlichen Zählerstand beobachten Sie beim gegebenen Codefragment in Simulation und Synthese den Zustand `flag='1'`? Warum ist dies so?
- ⇒ Die Zählerinkrementierung wird erst mit einer Verzögerung von einem Taktzyklus sichtbar, darum wird das Signal `flag` tatsächlich den Zählerstand `0x00` signalisieren.

# Aufgabe 4 - VHDL-Entwurfsprozess I

- b) Das `flag`-Signal (vom Typ `bit`) soll den Zählerstand `0xff` anzeigen, d.h. zum Zeitpunkt `count=X'ff` für eine Taktperiode den Wert 1 annehmen, sonst 0.
- Das `flag`-Signal soll nicht synchron innerhalb des Prozesses sondern nebenläufig außerhalb erzeugt werden. Wie lautet die VHDL-Zuweisung hierfür bzw. was muß am Quelltext geändert werden?

```
⇒ flag<='1' when count=X'ff' else '0';
```

b) Das `flag`-Signal (vom Typ `bit`) soll den Zählerstand `0xff` anzeigen, d.h. zum Zeitpunkt `count=X'ff` für eine Taktperiode den Wert 1 annehmen, sonst 0.

- Das `flag`-Signal soll nicht synchron innerhalb des Prozesses sondern nebenläufig außerhalb erzeugt werden. Wie lautet die VHDL-Zuweisung hierfür bzw. was muß am Quelltext geändert werden?

⇒ `flag<='1' when count=X'ff' else '0';`

## Aufgabe 5: VHDL-Entwurfsprozess II – DFT

- Realisierung einer Fourier-Transformation
- Durchführung von
  - Datenverfeinerung
  - Strukturverfeinerung
  - Verhaltensverfeinerung

## Aufgabe 5a) Datenverfeinerung

- Realisierung abstrakter Datentypen durch einfachere Datentypen
- Synthese: Binärer Datentyp bzw. erweiterter binärer Datentyp (incl. Tri-state-Zustand, `std_logic`)

## Datenverfeinerung und Schnittstellenbeschreibung

- Stream kann nicht direkt modelliert werden
- Passende Schnittstelle:  
Daten, Gültigkeitsanzeige, Aufnahmebereitschaft, Stream-Ende

## Lösung: Schnittstellenbeschreibung

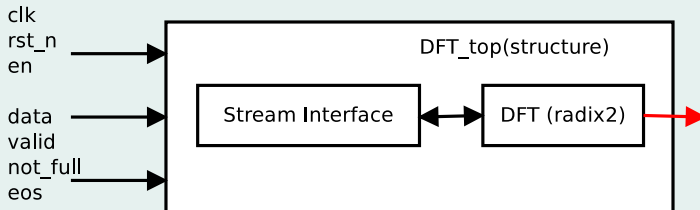
```
entity DFT_top is
 generic (
 C_DATA_SIZE : integer := 16 -- Parametrisierbare Datengröße
);
 port (
 clk : in std_logic;
 rst_n : in std_logic; -- low-aktives Rücksetzen
 en : in std_logic; -- Aktivierungssignal

 -- Eingangs-Stream
 data : in std_logic_vector(C_DATA_SIZE-1 downto 0);
 valid : in std_logic;
 not_full : out std_logic;
 eos : in std_logic
);
end entity;
```

## Aufgabe 5b) Strukturverfeinerung

Realisierung einer spezifizierten Funktion durch Verschaltung von Komponenten mit einfacherer Funktionalität

## Lösung: Architektur



(roter Pfeil: sinnvollerweise Ausgabe der transformierten Daten)

# Aufgabe 5 - VHDL-Entwurfsprozess II

architecture structure\_top of DFT\_top is

```
component stream_interface
 generic (C_DATA_SIZE : integer := 16);
 port (
 clk : in std_logic;
 rst : in std_logic;
 -- pass data to fourier instance
 data_out : out std_logic_vector(C_DATA_SIZE-1 downto 0);
 valid_out : out std_logic;
 not_full_in : in std_logic;
 eos_out : out std_logic;
 -- new data from outside
 data_in : in std_logic_vector(C_DATA_SIZE-1 downto 0);
 valid_in : in std_logic;
 not_full_out : out std_logic;
 eos_in : in std_logic
);
end component;
```

# Aufgabe 5 - VHDL-Entwurfsprozess II

```
component DFT
 generic (C_DATA_SIZE : integer := 16);
 port (
 clk : in std_logic;
 rst : in std_logic;
 data : in std_logic_vector(C_DATA_SIZE-1 downto 0);
 valid : in std_logic;
 not_full : out std_logic;
 eos : in std_logic
);
end component
```

# Aufgabe 5 - VHDL-Entwurfsprozess II

```
signal data_s2f : std_logic_vector(C_DATA_SIZE-1 downto 0);
signal valid_s2f : std_logic;
signal not_full_f2s : std_logic;
signal eos_s2f : std_logic;

signal not_full_i : std_logic;

signal rst : std_logic;

begin

 -- buffer output ports
 not_full <= not_full_i;

 rst <= not rst_n;
```

# Aufgabe 5 - VHDL-Entwurfsprozess II

```
stream_instance : stream_interface
generic map (C_DATA_SIZE => 16)
port map (
 clk => clk;
 rst => rst;

 --pass data to fourier instance
 data_out => data_s2f;
 valid_out => valid_s2f;
 not_full_in => not_full_f2s;
 eos_out => eos_s2f;

 --new data from outside
 data_in => data;
 valid_in => valid;
 not_full_out => not_full_i;
 eos_in => eos
);
```

```
fourier_instance : DFT
generic map (C_DATA_SIZE => 16)
port map (
 clk => clk;
 rst => rst;
 data => data_s2f;
 valid => valid_s2f;
 not_full => not_full_f2s;
 eos => eos_s2f
);

end structure_top;
```

## Aufgabe 5c) Verhaltensverfeinerung

- Detailliertes Ausarbeiten der gewünschten Funktionalität
- Ersetzen von Black-Boxes

## Behandlung/Darstellung der komplexen Einheitswurzel

- Einheitswurzel:  $e^{-2\pi ik/N}$
- $e^{ix} = \cos x + i \cdot \sin x$
- $N$  und mögliche  $k$  bekannt  $\Rightarrow$  Wertetabelle anlegen für die Sinus-Werte  $\sin(2k\pi/N) \quad \forall 0 \leq k < N$
- ```
type rom_type is array(integer range <>) of float;  
sine_rom : rom_type(0 to N-1) := {0.0, 0.383,  
                                   0.707, 0.924, 1.0,  
                                   0.923 ... -0.383};
```
- Cosinus-Werte: Andere Indizierung der Tabelle

Aufgabe 5d) Configuration

- Zuordnung einer Architektur zu einer Schnittstelle
- Festlegung verwendeter Architecture zu verwendeter Komponente
- Konfiguration, z.B. von Signalbreiten

Lösung: Radix-2-Variante

- Auswahl einer passenden Architektur über Konfiguration:

```
configuration cfg of DFT_top is:
  -- for which architecture?
  for structure
    -- for which instance/component?
    for all : DFT
      -- architecture "radix2" of DFT
      use entity work.DFT(radix2);
    end for;
  end for;
end cfg;
```

Übung #2 – 15.05.2014

- Low-Power-Entwurf / Leistungsaufnahme
- Leistungsbewertung von Rechensystemen
- (Fehlertoleranz)

Übungsleiter

■ Oliver Mattes

mattes@kit.edu

Raum B2-308.2, Geb. 07.21 (Technologiefabrik)

0721/608-48066

Webseite

<https://capp.itec.kit.edu/teaching/rs/>

Fragen?

Zentralübung Rechnerstrukturen im SS 2014

Fragen des Rechnerentwurfs: Fertigung und Hardwareentwurf

Oliver Mattes, Prof. Dr. Wolfgang Karl

Lehrstuhl für Rechnerarchitektur und Parallelverarbeitung

24. April 2014

